

ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 2010

№7 июль

Ежемесячный
научно-технический
журнал
основан в 1939 г.

Издается
с приложением
«Метрология»

УЧРЕДИТЕЛИ

Федеральное агентство
по техническому регулированию
и метрологии

ФГУП «Всероссийский
научно-исследовательский
институт метрологии
им. Д.И. Менделеева»

ФГУП «Всероссийский
научно-исследовательский
институт оптико-физических
измерений»

ФГУП «Всероссийский
научно-исследовательский
институт физико-технических
и радиотехнических измерений»

ФГУП «Всероссийский
научно-исследовательский
институт метрологической
службы»

ФГУП «Уральский
научно-исследовательский
институт метрологии»

ФГУП «Российский
научно-технический центр
информации по стандартизации,
метрологии и оценке соответствия»

Метрологическая академия

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Б. М. СТЕПАНОВА — ПЕРВОГО ДИРЕКТОРА ВНИИОФИ

- В. С. Иванов, Ю. М. Золотаревский, Н. П. Муравская, В. П. Кузнецов.** О роли первого директора ВНИИОФИ Б. М. Степанова в создании новых научных направлений в физике 3
- Г. Г. Фельдман, А. Б. Берлизов, М. А. Карпов, В. Б. Лебедев, А. А. Палем.** Генератор временных интервалов на основе эталона Фабри — Перо 7
- А. А. Демченко, В. Б. Лебедев, Г. Г. Фельдман.** Использование многокадровых электронно-оптических камер для измерения скоростей перемещения 10
- К. Ш. Абдрахманов, М. В. Улановский.** Установка для измерений параметров качества короткоимпульсного лазерного пучка 13
- Б. Б. Хлевной, В. И. Саприцкий, С. С. Колесникова.** Международные сличения CCPR-S1 единиц спектральной плотности энергетической яркости в диапазоне длин волн 220—2500 нм 16
- С. П. Морозова, Б. Е. Лисянский, Н. А. Парфентьев, А. С. Панфилов, А. Н. Рыбакова.** Монохроматический источник излучения для калибровки аппаратуры наблюдения Земли по относительной спектральной чувствительности 22
- С. И. Аневский, Б. С. Волков, И. В. Дробков, Д. Н. Лашков, О. А. Минаева, Р. В. Минаев, Д. С. Сенин, Ю. В. Цветков.** Разработка и исследование измерительного комплекса энергетической яркости в области вакуумного и ближнего ультрафиолета на основе ПЗС-матрицы 26
- Ю. М. Золотаревский, С. И. Аневский, В. С. Иванов, В. Н. Крутиков, В. М. Лахов, О. А. Минаева, Р. В. Минаев.** Использование синхротронного излучения для исследования многослойных наноструктур 32
- В. Л. Минаев, К. Е. Лощилов.** Влияние эффекта изменения фазы отраженной волны на измерения формы поверхности в оптической профилометрии 36
- Г. Г. Левин, Я. А. Илюшин, В. Л. Минаев, Н. Н. Моисеев.** Определение наноперемещений объекта по оптическому фазовому изображению 38
- А. И. Глазов, В. С. Иванов, В. Е. Кравцов, А. Б. Пнев, С. В. Тихомиров.** Метрологическое обеспечение измерений параметров волоконно-оптических систем передачи информации 43
- Д. Ф. Зайцев, В. Н. Крутиков, К. Ю. Сахаров, С. В. Тихомиров.** Проблемы метрологического обеспечения измерений параметров оптических сигналов и устройств в радиолокационных системах аналоговой нанофотоники 49
- С. В. Тихомиров, К. Ю. Сахаров, О. В. Михеев, В. А. Туркин, А. В. Сухов, А. И. Алешко.** Эталонный комплекс сверхкоротких электромагнитных импульсов с длительностью фронта 20 пс 57
- В. В. Григорьев, В. Е. Кравцов, А. К. Митюреев, А. Б. Пнев, С. В. Тихомиров.** Эталонная аппаратура для средств измерений поляризационной модовой дисперсии в волоконно-оптических системах передачи информации 60
- К. Ю. Сахаров, О. В. Михеев, В. А. Туркин, А. В. Сухов, А. И. Алешко.** Исследование неопределенности воспроизведения единиц напряженностей импульсных электрического и магнитного полей в эталонном комплексе сверхкоротких электромагнитных импульсов с длительностью фронта 20 пс 65
- И. В. Маленков.** Применение кристаллофосфоров на основе редкоземельных элементов для определения спектрального разрешения и калибровки шкалы длин волн люминесцентных спектрометров 67
- Н. П. Муравская, В. М. Лахов, С. А. Кайдалов, А. В. Иванов.** Оптико-физические измерения в химической физике, физической химии и нанохимии 70